

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

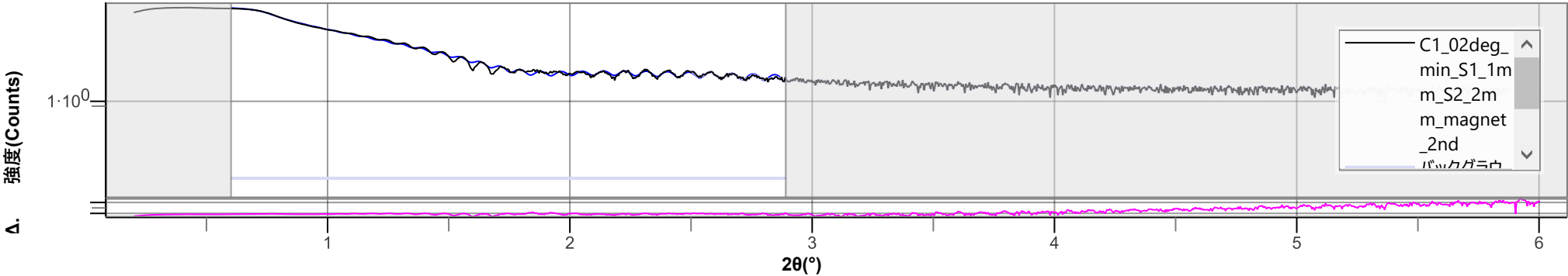
波長(nm): 0.15403
点数: 1451
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>		密度(g/cm³)<d>		粗さ(nm)<rg>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	L5	Fe2O3	0.404	Const	4.94174	Const	0.548	Con...	
				±0.018	精密化	±0.04	→最大 精密化	±0.007	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	1.790	Const	2.48592	Const	1.500	Con...	
				±0.018	精密化	±0.05	最小→ 精密化	±0.03	→最大 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe	4.184	Const	7.87363	Const	1.018	Con...	
				±2	精密化	±0.06	→最大 精密化	±0.015	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	88.568	Const	7.31730	Const	0.926	Con...	
				±0.07	精密化	±0.05	→最大 精密化	±0.03	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	2.713	Const	3.93765	Const	0.875	Con...	
				±0.12	精密化	±0.15	最小→ 精密化	±0.06	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con...	